Journées thématiques du Réseau Semi-conducteurs IN2P3-IRFU. Méthodes
de test orientées simulation

ID de Contribution: 17

Type: Non spécifié

**Visite virtuelle : Présentation des moyens de
caractérisation de semi-conducteurs à l'INL : du
matériau au dispositif**

jeudi 10 juin 2021 15:00 (15 minutes)

Orateurs: CALMON (INL), Francis (INL); CHAUVIN (INL), Nicolas (INL); PITTET (INL), Patrick (INL)

Classification de Session: Visites par groupes